

УДК 669.781 24.017.3:539.213

©1994

О ВЛИЯНИИ КОРРЕЛЯЦИЙ ВО ВЗАИМНОМ РАСПОЛОЖЕНИИ ДЕФЕКТОВ АТОМНОГО УРОВНЯ НА КИНЕТИКУ РЕЛАКСАЦИИ АМОРФНЫХ СПЛАВОВ

Ю.А.Беспалов

Рассмотрены особенности на высокотемпературных кривых изменения приведенного электросопротивления, связанные с наличием корреляций во взаимном расположении дефектов атомного уровня строения аморфных сплавов. Показано, что взаимодействие дефектов приводит к появлению логарифмического слагаемого в уравнении релаксации.

Все применяющиеся для получения аморфных металлических сплавов методы (быстрой закалки расплава, осаждения из газовой фазы и т.д.) являются существенно неравновесными в том смысле, что приводят к появлению материалов, состояние которых не соответствует внешним условиям, а определяется кинетикой процесса структурообразования. Поэтому увеличение подвижности атомов аморфного вещества при последующей термической обработке способствует протеканию релаксационных процессов и изменению уровня структурно-чувствительных свойств. На основе работ Т.Егами^[1] различают низкотемпературную стадию структурной релаксации, связанную с изменением степени химического ближнего порядка CSRO, характеризующуюся широким спектром энергии активации E_A , и более высокотемпературную, связанную с изменением топологического ближнего порядка TSRO, имеющую определенную E_A или набор E_A^i .

Аморфные сплавы не являются однородными металлическими системами. Экспериментально установлено наличие в них локальных областей, характеристики ближнего порядка в которых отличаются от средних по объему материала значений^[2,3]. Флуктуации в расплаве, склонность системы к фазовому расслоению, условия растекания и затвердевания расплава, воздействие закалочной атмосферы обуславливают появление микроскопических и макроскопических неоднородностей в материалах^[4-6]. Наличие микро- и макроструктуры также оказывает влияние на кинетику релаксационного изменения электросопротивления.

Дефекты, представляющие собой квазивакансационные образования (n -дефекты) или квазивнедренные атомы (p -дефекты), являются эффективными рассеивателями электронов, и изменение их концентрации и формы вносит максимальный вклад в изменение электросопротивления на стадии релаксации. Следует различать изолированные p - и

n-дефекты (сюда же относятся скопления нескольких дефектов одного знака), находящиеся на различной стадии релаксации, и дефекты, образованные близкорасположенными дефектами разного знака (дефекты локального *l*-типа). К дефектам *l*-типа относятся τ -дефекты [7], однако геометрия взаимного окружения может быть более сложной, а локальная деформация среды не сводится к чистому сдвигу. Расстояния между дефектами *p*- и *n*-типа, образующими *l*-дефект, достигают нескольких межатомных расстояний, а степень взаимодействия определяется величиной послойного коэффициента упаковки атомов [8]. По всей вероятности, дефекты локального уровня возникают на стадии получения материала вследствие действия механизмов, подобных эффекту самозатенения [9], и больших пластических деформаций, сопровождающих процесс закалки (косвенным подтверждением действия эффекта самозатенения могут служить правильные оценки температуры стеклования, плотности, модуля Юнга, полученные в перколяционной модели [10]).

Результаты численного моделирования [11] свидетельствуют о возможности «рассасывания» дефектов *p*- и *n*-типов в процессе отжига аморфного материала. При этом на начальной стадии релаксации необходимо коллективное смещение атомов, непосредственно прилегающих к дефекту. Степень корреляции смещений атомов прилегающих областей (а значит, и величина энергии активации) зависит от степени релаксации областей материала, непосредственно прилегающих к дефекту. Это приводит к очень высокому ($E_l = \infty$) значению энергии активации для начальной стадии релаксации дефектов *l*-типа. Вследствие разрыхления окружения в процессе отжига становится доступным все большее число релаксационных степеней свободы, что приводит к появлению особенностей на кривых изменения структурно-чувствительных свойств (доступность означает, что время релаксации не превосходит времени эксперимента [12]). Следует отметить, что на отличия кинетики релаксации *p*- , *n*- и τ -дефектов указывалось в работе Егами [13], однако детально этот вопрос им не исследовался.

Целью настоящей статьи является изучение особенностей поведения дефектной структуры аморфных металлических сплавов (стадия TSRO), связанных с различиями дефектов атомного и локального уровней строения.

Пусть в системе имеются два сорта дефектов *a*- и *l*-типов, энергии активации релаксации которых E_a и E_l соответственно, где $E_l = \infty$, если *a*-дефекты, окружающие *l*-дефект, не испытали релаксации, и $E_l = E_l$, если *a*-дефекты релаксировали. Поскольку стадия TSRO не обратима [1], то

$$d\Delta n_a(t)/dt = -W_a \Delta n_a(t), \quad (1)$$

где $\Delta n_a(t) = n_a(t) - n_\infty^a$; n_∞^a — концентрация *a*-дефектов при $t = \infty$; $W_a = W_a^0 \exp(-E_a/RT)$ — вероятность релаксации *a*-дефекта. Тогда

$$\Delta n_a(t) = n_{eff}^a \exp(-t/\tau_a), \quad (2)$$

где $\tau_a = \tau_0 \exp(E_a/RT)$ — время релаксации, $n_{eff}^a = (n_0^a - n_\infty^a)$ — эффективная плотность *a*-дефектов. Поскольку измерения электросопро-

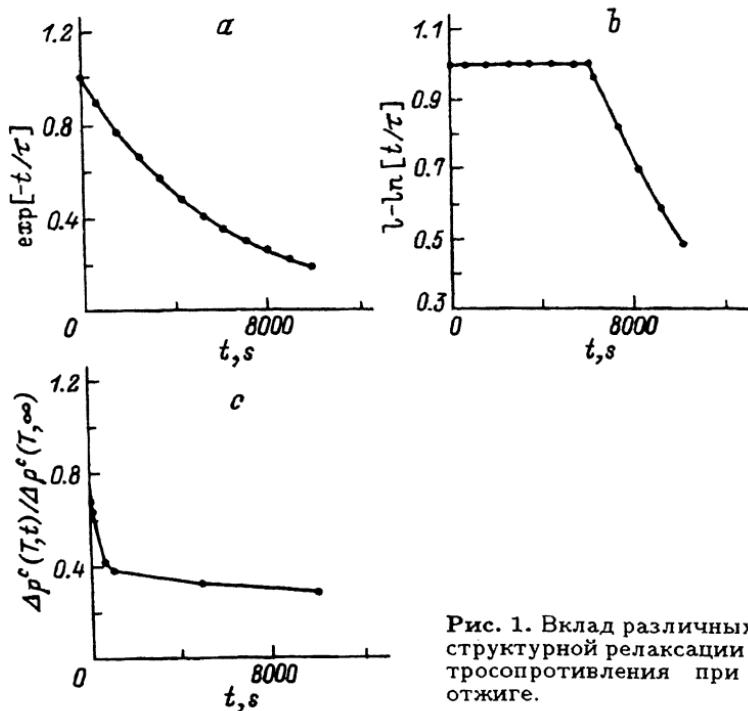


Рис. 1. Вклад различных стадий процесса структурной релаксации в изменение электросопротивления при изотермическом отжиге.

тивления проводятся в изотермических условиях, то для изменения ρ , обусловленного отжигом дефектов, можно записать

$$\rho(t)/\rho_0 = \sum_i A_i n_i(t), \quad (3)$$

где $n_i(t)$ — концентрация дефектов сорта i , A_i — константа. На основании формул (2), (3) запишем

$$\Delta\rho^T(T,t)/\Delta\rho^T(T,0) = \exp(-t/\tau_a), \quad (4)$$

где $\Delta\rho(T,t) = \rho(T,t) - \rho(T,\infty)$, а индекс T обозначает принадлежность к стадии TSR. Указанная зависимость для $E_a = 250$ кДж/моль представлена на рис. 1, a.

Высота потенциального барьера в l -системе зависит от состояния a -системы, поэтому эффективное время эксперимента при отжиге l -дефектов $t_{eff}^l(E_a, t) = W_a t$ значительно меньше t . Отсюда

$$\Delta n^l(t) = n_{eff}^l \exp[-(t/\tau_l) \exp(-E_a/RT)], \quad (5)$$

где $\tau_l = \tau_0 \exp(E_l/RT)$ — время релаксации l дефекта.

Таким образом, мы имеем дело с индуцированным переходом в системе. В качестве характеристики глубины протекания релаксации здесь может служить функция доступности P [12], определяемая при помощи соотношения

$$P[t, \tau_l, E_a] = \begin{cases} 1, & t^l(E_a, T) \gg \tau_l, \\ 0, & t^l(E_a, T) \ll \tau_l. \end{cases}$$

Пусть $t \gg \tau_a$, тогда эффективная плотность a -дефектов равна n_{eff}^a , а эффективная плотность доступных степеней свободы

$$n_{eff}(T) = n_{eff}^a + n_{eff}^l \langle P[t, \tau_l, E_l] \rangle_t, \quad (6)$$

где

$$\langle P[t, \tau_l, E_a] \rangle_t = \int_0^\infty P[t, \tau_l, E_a] \Omega_\tau(t) dt,$$

$\Omega_\tau(t)$ — плотность распределения времен релаксации.

Поскольку τ_l является функцией E_a и E_a постоянна в течение всего процесса релаксации, то удобно перейти к среднему по энергии

$$\langle P[t, \tau_l, E_a] \rangle_E = 1/\Omega \int_0^\infty P[t, \tau_l, E_a] \Omega_E(E_a) dE_a,$$

где $\Omega(E_a) = \delta(E - E_a)$, $\Omega = \int_0^\infty \Omega_E(E_a) dE_a$ — нормировочный множитель.

Далее, следуя [12], можем записать

$$\langle P[t, \tau_l, E_a] \rangle_E = RT/E_a \ln[t/\tau_l], \quad (7)$$

где $t > \tau_a$. Таким образом, эффективная плотность релаксирующих центров возрастает при увеличении температуры и времени отжига сплавов. Тогда

$$\Delta n_{eff}^l(t) = n_{eff}(1 - RT/E_a \ln[t/\tau_l]), \quad (8)$$

$$\frac{\Delta \rho^T(T, t)}{\Delta \rho^T(T, \infty)} = \exp(-t/\tau_l) + A(1 - RT/E_a \ln[t/\tau_l]) \exp(-t/\tau_l), \quad (9)$$

где величина A зависит от соотношения эффективных длин рассеяния электронов (которые практически совпадают) и соотношения n_{eff}^a и n_{eff}^l .

Согласно (9) и рис. 1,а,б, на кривой $\Delta \rho(T, t)/\Delta \rho(T, \infty)$ должен появиться перегиб в точке $t = 6 \cdot 10^3$ с ($E_l = E_a = 250$ кДж/моль), величина которого определяется температурой отжига и плотностью дефектов l -типа.

В качестве объектов исследования использовались образцы аморфного сплава $\text{CO}_{84}\text{Fe}_{5.9}\text{Si}_{8.5}\text{B}_{2.2}$, полученного спиннингованием расплава. Изометрические отжиги образцов проводились в вакууме 10^{-6} . Точность поддержания температуры составляла $\pm 0.5^\circ$. Измерение электросопротивления проводили по четырехточечной методике [14]. Фиксация результатов проводилась по точкам. На кривых $\rho(T, t)/\rho_{600}$

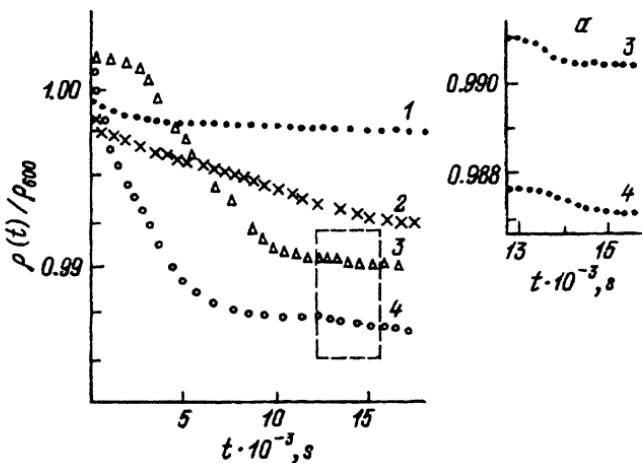


Рис. 2. Кривые изменения приведенного электросопротивления при изотермических отжигах сплава Co₈₄Fe_{5.3}Si_{8.5}B_{2.2}.

Выделенный фрагмент α увеличен в 2.5 раза. $T = 623$ (1), 650 (2), 661 (3), 676 К (4).

(рис. 2), соответствующих температурам $T = 661$ и $T = 676$ К, наблюдается перегиб для $t = (1 \div 1.4) \cdot 10^4$ с, что согласуется с теорией (величина энергии активации здесь составляет 272 кДж/моль).

Описание низкотемпературных зависимостей $\rho(T, t)/\rho_{600}$ можно провести на основании представления о спектре энергии активации процесса CSRO [1], для которого

$$\frac{\Delta\rho^c(T, t)}{\Delta\rho^c(T, \infty)} = \frac{RT \ln(\nu_0 t) - E_{\min}}{\Delta E}, \quad (10)$$

где E_{\min} — минимальная энергия активации, $\Delta E = E_{\max} - E_{\min}$ — ширина спектра энергий активации, ν_0 — характеристическая частота, индекс c обозначает принадлежность к стадии CSRO. График зависимости $\Delta\rho^c(T, t)/\Delta\rho^c(T, \infty)$, рассчитанный по формуле (10) для $E_{\min} = 130$, $E_{\max} = 250$ кДж/моль и $T = 600$ К, представлен на рис. 1,с.

Таким образом, при описании влияния дефектов аморфного состояния на процессы релаксации паряду со структурными характеристиками создаваемых ими искажений необходимо учитывать кинетические особенности процессов получения этих материалов. В этом смысле дефекты в неравновесных системах являются не только структурными, но и кинетическими образованиями.

Необходимо отметить, что величина рассмотренных в настоящей статье перегибов составляет несколько процентов от общей величины эффекта релаксационного изменения электросопротивления. Поэтому для однозначного ответа на вопрос о причине перегиба на кривых $\rho(T, t)$ необходимо повышение точности эксперимента.

Автор считает своим долгом выразить благодарность М.В.Белоусу и Ю.А.Кунишкому за помощь в работе.

Список литературы

- [1] Van den Beukel A. // Papidly solidified matter. Proc. Int. Conf. San Diego: Calif., 1985. P. 193–203.
- [2] Гаскелл Ф. Металлические стекла. В. 2 / Под ред. Г.Бека, Г.Гюнтеродта. М.: Мир, 1986. С. 12–63.
- [3] Riviero J.M., Madurda V., Hermando A. // Phys. Rev. B. 1989. V. 39. N 16. P. 11950–11955.
- [4] Дорофеева Е.А., Прокошин А.Ф. // ФММ. 1984. Т. 57. № 3. С. 500–505.
- [5] Каневский А.Г., Сапожникова Л.В., Новиков М.А. // Изв. АН СССР. Сер. металллы. 1989. № 6. С. 170–176.
- [6] Пелтон А.Р., Теннер Л.Е. Быстроохлажденные металлические сплавы / Под ред. С.Штиба и Г.Варлимонта. М.: Металлургия, 1989. С. 169–173.
- [7] Egami T., Maeda R., Vitek V. // Phil. Mag. A. 1982. V. 40. N 6. P. 883–901.
- [8] Беспалов Ю.А. // Автореф. канд. дис. Киев, 1991. 152 с.
- [9] Leamy H.J., Gilmer G.H., Dirks A.G. // Current Topics of Matter. Sci. 1981. V. 6. P. 309–344.
- [10] Ахиезер А.И. // Металлофизика. 1984. Т. 6. № 5. С. 3–7.
- [11] Bennet G.H., Chaudhari P., Moruzzi V. // Phil. Mag. A. 1979. V. 39. N 4. P. 485–495.
- [12] Пьетронеро Л. Фракталы в физике / Под ред. Л.Пьетронеро и Э.Тозатти. М.: Мир, 1988. С. 586–591.
- [13] Егами Т. // Аморфные металлические сплавы / Под ред. Ф.Е.Люборского. М.: Металлургия, 1987. С. 92–106.
- [14] Дрозд Л.Н., Лысов В.И., Михайловский В.Б. // Тез. докл. III Всес. конф. «Проблемы исследования структуры аморфных металлических сплавов». М., 1988. С. 153–154.

Киевский политехнический институт

Поступило в Редакцию
10 января 1992 г.
В окончательной редакции
22 июля 1992 г.
